

07,13,12

Измерение силы удара зонда атомно-силового микроскопа, работающего в режиме амплитудной модуляции

© Б.О. Щербин¹, А.В. Анкудинов^{1,2}, А.В. Киюц³, О.С. Лобода³

¹ Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия

² Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

³ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: Alexander.ankudinov@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 22 июля 2013 г.)

Рассмотрен способ исследований силового взаимодействия в динамических режимах атомно-силового микроскопа. Проведены прямые измерения максимальной силы удара в режиме амплитудной модуляции. Выявлено согласие результатов аналитических расчетов с численным моделированием и более чем полуторакратное отличие от данных эксперимента. Проанализированы основные факторы, влияющие на результаты.

Работа поддержана грантами РФФИ № 12-01-00815-а и 12-08-00389-а, а также проектом УМ.Н.И.К.

1. Введение

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) [1] хорошо приспособлена для изучения поверхности образца: его рельефа, локальных электрических, магнитных, механических, трибологических свойств [2]. Исследования возможны в обычных условиях, вакууме, жидкости, в том числе агрессивной, при контролируемых вариациях температуры, внешних магнитных, электрических, оптических полей [3]. Дальнейшее совершенствование АСМ идет в направлении уменьшения разрушающего воздействия и продолжительности измерений, а также повышения количественного уровня данных [4–6].

Существует несколько режимов работы атомно-силового микроскопа. Статический, контактный режим [3] считается количественным и быстрым, но наиболее разрушающим ввиду неполного контроля сил трения [3]. Квазистатические, поточечные спектроскопические методики, такие как „силовое пространство“ (force volume) [7] и „количественная наномеханика“ (peak force quantitative nanomechanics) [8], позволяют уменьшить вклад сил трения, но за счет быстрого действия. Минимизировать трение без относительной потери времени удается в динамических режимах амплитудной модуляции (режим прерывистого контакта, tapping mode) [9] и частотной модуляции (бесконтактный режим) [10]. Режим частотной модуляции считается количественным, для него разработана достаточно полная аналитическая теория [11], оптимально он реализуется в вакуумных условиях. К исследованиям на воздухе и, в особенности, в жидкости лучше приспособлен режим амплитудной модуляции. Для количественной оценки силового воздействия в режиме амплитудной модуляции используют численное моделирование, также применяют несколько приближенных аналитических подходов [12–14].

Ранее проводились непосредственные измерения средней силы взаимодействия в динамических режимах. Для этого использовались опорный кантилевер с известной жесткостью и дополнительная оптическая система детектирования его отклонений [15] либо более простая схема с опорным пьезокантилевером [16]. Для количественного контроля деформации образца в ходе получения АСМ-изображения важнее не средняя за период сила, а максимальная, пиковая сила. Прямо определять максимальную силу недавно стало возможным с помощью торсионных кантилеверов [17]. Используя такой кантилевер, очень быструю схему регистрации, а также специальный алгоритм выделения полезного сигнала, можно измерять высокочастотные силовые зависимости [17,18], аналогичные стандартным статическим силовым кривым контактного режима.

Цель настоящей работы состояла в рассмотрении относительно более простого, альтернативного способа исследования максимальной силы взаимодействия в динамических АСМ-режимах. Были изготовлены специальные устройства с измеримой жесткостью, представляющие собой наномостики над микропорой. С их помощью в режиме амплитудной модуляции измерялись изменения силы удара, вызванные приращением амплитуды. Экспериментальные результаты сопоставлялись с оценкой величины силы, полученной с помощью приближенного подхода, рассмотренного в работе [14], а также с данными численного моделирования.

2. Теоретический анализ АСМ режима частотной модуляции

В статическом контактном АСМ-режиме сила взаимодействия пропорциональна отслеживаемому углу отклонения кантилевера от равновесия и его коэффициенту

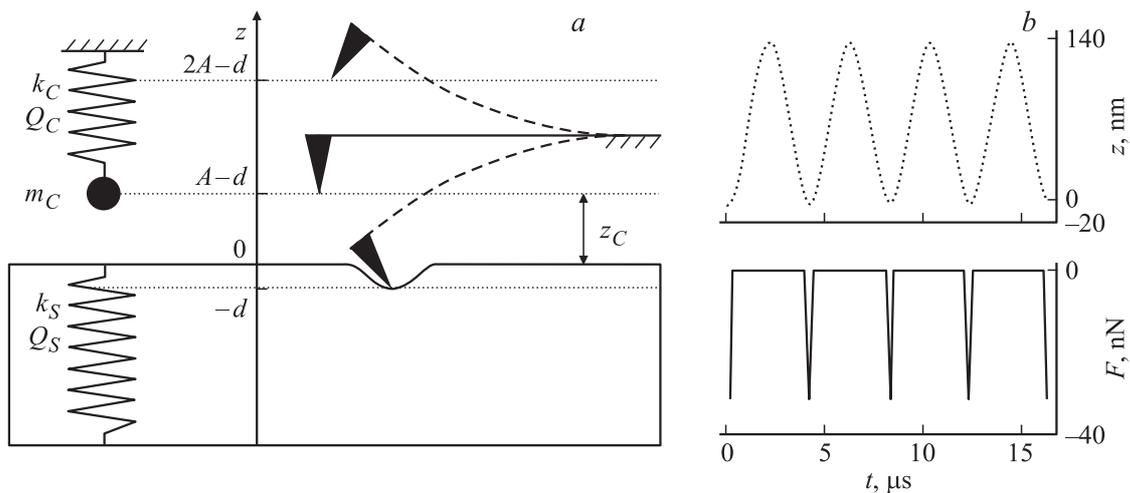


Рис. 1. *a)* Механическая модель для описания режима АМ: кантилевер (пружина с точечной массой m_C , добротностью Q_C , жесткостью k_C и положением равновесия z_C) взаимодействует с образцом (безмассовая пружина с жесткостью k_S и добротностью Q_S деформируется на глубину $-d$). *b)* Пример данных численного расчета: зависимости координаты и силы от времени. Параметры расчета режима АМ и взаимодействия зонда с образцом: $f = f_0 = 247.2$ КHz, $A_0 = 100$ nm, $\xi = 0.7$, $Q_C = 242$, $k_C = k_S = 12$ N/m, $Q_S = 24$.

жесткости k_C . В динамических режимах, частотной модуляции (ЧМ) и амплитудной модуляции (АМ), определить максимальную (пиковую) силу взаимодействия принципиально сложнее, так как кантилевер вибрирует вблизи поверхности и лишь малую долю периода контактирует с ней (рис. 1).

В режиме ЧМ кантилевер самовозбуждается на резонансной частоте f , а сигналом обратной связи служат изменения этой частоты Δf [10–12]. Амплитуда возникающих осцилляций поддерживается с помощью обратной связи неизменной, а фаза внешнего возбуждения всегда отличается от фазы колебаний кантилевера ровно на $\pi/2$. Обычно амплитуда осцилляций A_0 существенно больше диапазона действия сил зонд–образец F_{TS} , и энергия осцилляций $k_C A_0^2/2$ значительно превышает энергию взаимодействия. В этом случае сдвиг частоты Δf может быть определен [11,12] по классической теории возмущений

$$\frac{\Delta f}{f_0} = -\frac{\langle F_{TS} z \rangle}{k_C A_0^2}, \quad (1)$$

где f_0 — частота невозмущенного резонанса кантилевера, z — расстояние от зонда до поверхности, которое принимает отрицательные значения при деформации образца (рис. 1). Для вычислений пользуются более универсальным соотношением, содержащим так называемый „нормализованный сдвиг частоты в пределе больших амплитуд“ $\gamma(d)$ [11,12]:

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{\gamma(d)}{k_C A_0^{3/2}}.$$

Вид $\gamma(d)$ определяется только ходом потенциала взаимодействия и минимальным расстоянием от зонда до

поверхности d . Явные зависимости $\gamma(d)$ были получены для степенного, обратного степенного и экспоненциального типа взаимодействия [11,12].

Табл. 1 помогает устанавливать связь сдвига частоты в режиме ЧМ с деформацией и силой при степенном законе взаимодействия. Например, при гармоническом взаимодействии (образец в виде пружины жесткости k_S , которая сжимается зондом на глубину d) сдвиг частоты на Δf происходит при следующей максимальной силе и деформации:

$$F_{\max} = \left(\frac{3\pi k_C \sqrt{k_S} \Delta f}{2\sqrt{2} f_0} \right)^{2/3} A_0, \quad d_{\max} = F_{\max}/k_S. \quad (2)$$

В общем случае степенного закона с показателем m сила с амплитудой связана нелинейно: $F_{\max} \sim A_0^{3m/(2m+1)}$. Поэтому линейность силы по амплитуде, следующая из (2), может служить в эксперименте индикатором гармонического закона взаимодействия.

3. Теоретический анализ АСМ-режима амплитудной модуляции

В режиме АМ частота возбуждения постоянна и обычно выбирается чуть меньше или равной значению невозмущенного резонанса f_0 , а сигналом обратной связи служат изменения амплитуды вынужденных колебаний кантилевера $A_0 - A$. Чтобы использовать достижения аналитической теории режима ЧМ при описании режима АМ, была предложена „простая интуитивная модель“ [14]. В этой модели нормализованный сдвиг частоты зависит не от амплитуды A_0 свободного резонанса вдали от поверхности, а от рабочей амплитуды A ,

Таблица 1. Нормализованный сдвиг частоты при степенном законе взаимодействия

Параметр	Сила			
	адгезии	гармоническая	модель Герца	общий вид
$F(d)$	$-F_A$	$k_S d$	$\frac{4}{3} K \sqrt{R} d \sqrt{d}$	$C d^m$
$\gamma(d)$	$-\frac{\sqrt{2}}{\pi} F_A \sqrt{d}$	$\frac{2\sqrt{2}}{3\pi} k_S d \sqrt{d}$	$\frac{\sqrt{2}}{4} K \sqrt{R} d^2$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\Gamma(m+1)}{\Gamma(m+3/2)} C d^{m+1/2}$

Примечание. $\Gamma(m+1) = m!$; $\Gamma(m+3/2) = \sqrt{\pi}(2m+1)!!/2^{m+1}$; $\frac{1}{K} = \frac{1-v_S^2}{E_S} + \frac{1-v_P^2}{E_P}$; $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_P}$; $E_S, E_P, v_S, v_P, R_S, R_P$ — модули Юнга, коэффициенты Пуассона, радиусы кривизны образца (S) и зонда (P).

установившейся вблизи поверхности,

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{\gamma(d)}{k_C A^{3/2}}, \quad (3)$$

которая в свою очередь связана со сдвигом резонанса и A_0 формулой Лоренца

$$A = A_0 \frac{f/f_0}{\sqrt{Q_C^2 (f/f_0 - f_0/f)^2 + 1}}, \quad (4)$$

где Q_C — добротность резонанса кантилевера. В формуле Лоренца (4) отношение частот можно выразить через добротность и параметр рассогласования $\xi = A/A_0$:

$$\left(\frac{f_0}{f}\right)^2 = 1 - \frac{1}{2Q_C^2} + \sqrt{\frac{(\xi^2 - 1)}{Q_C^2} + \frac{1}{4Q_C^4}}. \quad (5)$$

Считая добротность резонанса большой (в обычных условиях она составляет несколько сотен и возрастает в вакууме до нескольких тысяч), а также используя приближенное соотношение $(f/f_0)^2 \approx 1 + 2\Delta f/f_0$, верное для малых Δf , упростим (5)

$$\frac{\Delta f}{f_0} \approx \frac{\sqrt{\xi^2 - 1}}{2Q_C}. \quad (6)$$

С помощью табл. 1, формул (3) и (6) вычислим максимальную силу и деформацию в режиме АМ при гармоническом законе взаимодействия

$$\begin{aligned} d_{\max} &\cong 1.405 \sqrt[3]{(\xi - \xi^3) k_C^2 / Q_C^2 k_S^2 A_0}, \\ F_{\max} &\cong 1.405 \sqrt[3]{(\xi - \xi^3) k_S k_C^2 / Q_C^2 A_0}. \end{aligned} \quad (7)$$

Соотношения (7) следуют также из аналитического решения, полученного в [13] (формулу (10а) этой работы нужно преобразовать для случая резонансного возбуждения).

4. Численное моделирование

Режим АМ был исследован численно с использованием модели работы [19]. Один цикл вынужденных осцилляций раскладывался на два промежутка: зонд не касается поверхности и зонд в контакте с ней. Кантилевер описывался пружиной жесткости k_C с точечной массой m , а образец — пружиной без массы жесткости k_S (рис. 1, а).

Трение в системе задавалось добротностью Q_C и Q_S для кантилевера и образца соответственно. Потенциал консервативных сил, который испытывает зонд в такой модели, записывается следующим образом:

$$\begin{aligned} V(z) &= V_C(z) + V_S(z) \\ &= \frac{k_C}{2} (z - z_C(t))^2 + \frac{k_S}{2} z^2 [1 - \Theta(z)], \end{aligned} \quad (8)$$

где $\Theta(z)$ — ступенчатая функция Хевисайда.

Пьезоактуатор, на котором закреплен кантилевер (на схеме рис. 1, а его роль выполняет линия закрепления пружины k_C), синусоидально вибрирует с амплитудой a на частоте f , и результирующее выражение для его движения $z_C(t)$ имеет вид

$$z_C(t) = z_C + a \cos(2\pi f t) = z_C + a \cos(\omega t). \quad (9)$$

В общем виде вынужденное движение кантилевера $z(t)$ в потенциале (8) задается следующим уравнением:

$$\begin{aligned} z''(t) + [\gamma_C + \gamma_S (1 - \Theta(z))] z'(t) + \omega_C^2 (z(t) - z_C) \\ + \omega_S^2 (1 - \Theta(z)) z(t) = a \omega_C^2 \cos(\omega t), \end{aligned} \quad (10)$$

где $\gamma_i = \omega_i / Q_i$, $i = (k_i/m)^{1/2}$, $i = c, s$ (c — кантилевер, s — образец).

Для численного решения (10) использовалась программа, написанная на языке C^{++} , реализующая метод Адамса четвертого порядка. Пример данных, по которым определялась максимальная сила, представлен на рис. 1, б. Результаты численного моделирования практически не зависели от добротности образца, если она не выбиралась близкой к единице. Численные эксперименты при возбуждении точно на частоте резонанса позволили пронаблюдать зависимости $F_{\max} \sim k_S^{1/3} k_C^{2/3}$ и $F_{\max} \sim Q_C^{-2/3}$, подтверждающие верность выражения (7).

5. Результаты измерений и их анализ

Для экспериментальной проверки теории и моделирования были изготовлены специальные образцы с нанотрубками, подвешенными над микропорами. В качестве источника нанотрубок использовался гидросиликат магния $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$, существующий в природе как минерал хризотил; хризотил также умеют синтезиро-

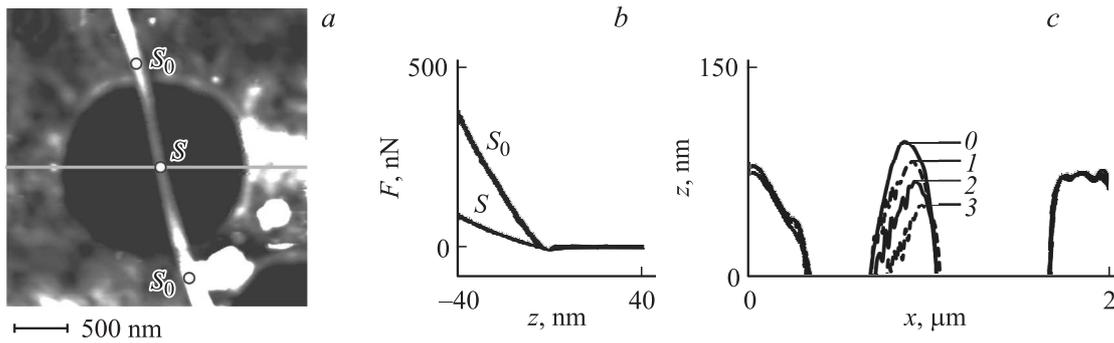


Рис. 2. *a)* Тоновое АСМ-изображение с наномостиком из наносвитка хризотила над порой в трековой лавсановой мембране. Параметры режима АМ: $f = f_0 = 247.2$ КГц, $A_0 = 50$ нм, $\xi = 0.7$, $k_C = 12$ Н/м. *b)* Силовые зависимости в центре наномостика и на краю поры. *c)* Профили высоты наномостика, измеренные в режиме АМ с разными значениями $A_0 = 50$ нм (0), 100 (1), 150 (2) и 200 нм (3).

вать из соответствующих реагентов в гидротермальных условиях [20]. Магниева и кремниевая подрешетки хризотила не согласованы по периоду, и для компенсации упругих напряжений кристаллам выгодно расти в форме наносвитков. Отдельные наносвитки можно выделить из дезинтегрированных образцов минерала или из синтезированного порошка. Согласно данным атомно-силовой и просвечивающей электронной микроскопии, внутренний диаметр наносвитка составляет около 5 нм, а внешний — около 30 нм, длина может достигать нескольких микрометров в случае синтезированного и нескольких миллиметров в случае минерального хризотила. Водная суспензия минерального хризотила осаждалась на трековую мембрану из лавсана с характерным диаметром пор 0.8 μm . Часть наносвитков перекрывала поры, и получались мостики-пружинки (рис. 2, *a*), которые использовались для определения максимальной силы взаимодействия в АСМ-режиме АМ.

Сначала вдоль выбранного мостика, не переходя из режима АМ в контактный, измеряли стандартные силовые кривые (рис. 2, *b*). По крутизне кривой S в выбранных точках на мостике, средней крутизне кривых S_0 в точках снаружи поры и жесткости зонда k_C , откалиброванной по стандартному алгоритму [21], определялась локальная жесткость

$$k_S = k_C \frac{S}{(S_0 - S)}. \quad (11)$$

На следующем шаге детектировалась серия АСМ-изображений мостика над порой при одинаковом рассогласовании $\xi = A/A_0 = 0.7$, но при четырех различных амплитудах A_0 . На каждом изображении анализировались профили высоты вдоль сечений через пору с мостиком и выбирался профиль с максимальным прогибом мостика относительно поверхности мембраны, прилегающей к поре. Затем проверялось совпадение положения выбранного сечения с окрестностью точки минимальной жесткости мостика k_S^{min} . Сравнивая четыре итоговых профиля (рис. 2, *c*) в области максимального прогиба, измеряли деформации мостика при увеличении A_0 от 50 до 100, 150 и 200 нм и вычисляли пропорциональные деформации и k_S^{min} изменения максимальной силы.

Результаты экспериментов с четырьмя аналогичными мостиками сведены в табл. 2. Там же приведены данные численного моделирования и расчета по формуле (7), использующие экспериментально измеряемые параметры: k_C , k_S^{min} и Q_C . Резонансные кривые измерялись на высоте A_0 над поверхностью, когда зонд ее еще не касается, добротность Q_C рассчитывалась по отношению частоты резонанса к его ширине на уровне 0.707. Резонансные кривые имели форму контура Лоренца, результирующая величина добротности практически не зависела от амплитуды для значений A_0 в диапазоне от 10 до 200 нм. При выборе A_0 больше 200 нм кривые искажались из-за появления нелинейности в оптической системе регистрации отклонений кантилевера [22]. Для значений A_0 меньше 10 нм контакт с образцом становился нестабильным. Резонансные кривые детектировались также на рабочем расстоянии A . В этом случае вершина кривой получалась отсеченной на высоте $A < A_0$, но вне сегмента отсечения ее форма слабо отличалась от контура, измеренного на расстоянии A_0 . В численном моделировании добротности образца и кантилевера полагались равными: $Q_S = Q_C$.

Согласно данным табл. 2 (см. также ее нижнюю часть), теоретические и модельные вариации максимальной силы практически совпадают, а экспериментальные значения превосходят их более чем в 1.5 раза.

Рассмотрим ряд факторов, влияющих на теоретический и экспериментальный результат. Используя данные табл. 1 и формулы (3) и (6), получим выражение для деформации с учетом вклада силы адгезии

$$d^{3/2} - \frac{3}{2} \frac{F_A}{k_S} d^{1/2} - d_{\text{max}}^{3/2} = 0. \quad (12)$$

Это уравнение решается точно. Рассмотрим, однако, его приближенный корень в виде $d^* = d_{\text{max}} + d_A$, где d_{max} соответствует соотношениям (7), а возмущение d_A мало по сравнению с ним. После подстановки в (12) получаем $d_A \approx F_A/k_S$. В этом приближении максимальная сила не изменится: $F^* = k_S d^* - F_A \approx F_{\text{max}}$. На силовых кривых рис. 2, *b* горизонтальный участок, где нет взаимодействия, сменяется наклонным участком, отвечающим

Таблица 2. Сравнение эксперимента с теорией

Объект (Параметры эксперимента)	ΔA_0 , nm	Изменение максимальной силы, pN		
		Эксперимент	Моделирование	Формула (7)
Наномостик 1 ($k_C = 6.4$ N/m, $Q_C = 154$, $k_S^{\min} = 1.6$ N/m)	50	$\Delta F_{11}^E = 18 \pm 4^A$	$\Delta F_{11}^S = 8$	$\Delta F_{11}^T = 7$
	100	$\Delta F_{12}^E = 26 \pm 5$	$\Delta F_{12}^S = 15$	$\Delta F_{12}^T = 14$
	150	$\Delta F_{13}^E = 34 \pm 7$	$\Delta F_{13}^S = 23$	$\Delta F_{13}^T = 21$
Наномостик 2 ($k_C = 12$ N/m, $Q_C = 208$, $k_S^{\min} = 0.8$ N/m)	50	$\Delta F_{21}^E = 12 \pm 2$	$\Delta F_{21}^S = 7$	$\Delta F_{21}^T = 7$
	100	$\Delta F_{22}^E = 22 \pm 4$	$\Delta F_{22}^S = 14$	$\Delta F_{22}^T = 14$
	150	$\Delta F_{23}^E = 35 \pm 7$	$\Delta F_{23}^S = 22$	$\Delta F_{23}^T = 21$
Наномостик 3 ($k_C = 12$ N/m, $Q_C = 242$, $k_S^{\min} = 12.1$ N/m)	50	$\Delta F_{31}^E = 16 \pm 3$	$\Delta F_{31}^S = 15$	$\Delta F_{31}^T = 15$
	100	$\Delta F_{32}^E = 37 \pm 7$	$\Delta F_{32}^S = 31$	$\Delta F_{32}^T = 31$
	150	$\Delta F_{33}^E = 58 \pm 12$	$\Delta F_{33}^S = 47$	$\Delta F_{33}^T = 46$
Наномостик 4 ($k_C = 12$ N/m, $Q_C = 280$, $k_S^{\min} = 4.1$ N/m)	50	$\Delta F_{41}^E = 14 \pm 3$	$\Delta F_{41}^S = 10$	$\Delta F_{41}^T = 10$
	100	$\Delta F_{42}^E = 31 \pm 6$	$\Delta F_{42}^S = 20$	$\Delta F_{42}^T = 20$
	150	$\Delta F_{43}^E = 46 \pm 9$	$\Delta F_{43}^S = 30$	$\Delta F_{43}^T = 29$
Усредненные значения, отнесенные к теоретическим	ΔA_0 , nm	$100 \cdot \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left(\frac{\Delta F_{ij}^{ES}}{\Delta F_{ij}^T} \right), \%$		
		Эксперимент	Моделирование	
	50	170 ± 55^B	104 ± 6^B	
	100	155 ± 25	101 ± 3	
150	155 ± 20	105 ± 3		

Примечание. Буквой *A* помечена ошибка измерений из-за неопределенности калибровки k_C , буквой *B* — среднеквадратичное статистическое отклонение, $i = 1, 2, 3, 4$ — номер наномостика, $j = 1, 2, 3$ нумерует соответствующие приращения амплитуды $\Delta A_0 = 50, 100, 150$ nm.

за отталкивающее взаимодействие. Область минимума, соответствующая отрицательным силам притяжения, на кривых практически не заметна. Статистический анализ силовых кривых, измеренных на наномостиках, показал, что $F_A = 5.9 \pm 2.1$ pN. Сила адгезии в разы и для больших амплитуд A_0 на порядок меньше вариаций максимальной силы, занесенных в табл. 2. Таким образом, в эксперименте выполняется требование малости d_A/d_{\max} , и вклад сил адгезии не существен.

Численная и аналитическая оценки силы зависят от добротности кантилевера, ($F_{\max} \sim Q_C^{-2/3}$). Гипотетическое уменьшение добротности в 2 раза по сравнению со значениями, приведенными в табл. 2, позволяет согласовать результаты. Такое уменьшение требует двукратного увеличения средних за период потерь энергии осцилляций возле поверхности. На рабочем расстоянии потери из-за трения кантилевера о воздух снижаются, так как они пропорциональны квадрату амплитуды колебаний [23]. Необходимые дополнительные потери энергии могут возникнуть только при неупругом взаимодействии зонда с образцом. Известно, что при выключенном внешнем возбуждении энергия осциллятора $E = k_C A^2 / 2$ каждый период уменьшается на величину $\Delta E = 2\pi E / Q_C$ [24]. Для параметров кантилевера в случае трубки 1 из табл. 2 и $A_0 = 50$ nm получим $\Delta E \approx 3 \cdot 10^{-16}$ J. Если использовать для максимальной силы значение $F = 10$ pN, то такие же дополнительные потери энергии ($\Delta E^* \sim FS$) могут появиться при периодической пластической деформации наномости-

ка $S = 30$ nm. Для экспериментальной оценки потерь мы анализировали стандартные силовые кривые, которые детектировались не только в прямом (нагрузка) (рис. 2, *b*), но и в обратном направлении (разгрузка), см. также работу [25]. Наблюдался незначительный гистерезис между нагрузкой и разгрузкой (шириной не более 5 nm). Соответствующие такому гистерезису потери малы (при характерном уровне нагрузки 10 pN $\Delta E^* < 5 \cdot 10^{-17}$ J), что дает основания считать значения добротности в табл. 2 достаточно достоверными.

Отличие эксперимента от теории на 50% и более наблюдается с достаточной точностью. Ранее было показано [26], что жесткость наномостика можно измерить с ошибкой около 25%, обусловленной главным образом выбранным методом калибровки жесткости кантилевера. В табл. 2 использованы значения статической жесткости наномостиков, определенные по силовым зависимостям, на детектирование которых затрачивалось несколько секунд. В режиме АМ зонд контактирует с образцом примерно десятую часть периода колебаний [12] (см., в частности, импульсы силы на рис. 1, *b*), т.е. время взаимодействия составляет доли микросекунд. Поэтому, строго говоря, сила взаимодействия пропорциональна динамической, высокочастотной жесткости наномостика. Теория и результаты измерений согласуются при динамической жесткости в 2 раза меньше статической. В принципе еще большее (в 4 раза) изменение жесткости наномостика можно ожидать, если при статической нагрузке его концы заземлены на краях поры, но лишь

опираются на края при динамическом воздействии (см. в [27] задачу о слабом изгибе балки в зависимости от условий закрепления ее концов). Важно исследовать в связи с этим вариации жесткости хризотилевых наномостиков с частотой воздействия при изменении условий окружения (роль относительной влажности), способа нанесения хризотила на мембрану (например, из спиртового раствора). Для способа АСМ-измерений жесткости наномостиков возможность контролировать условия закрепления имеет отдельную ценность, поскольку способ применяется для определения модуля Юнга нанотрубок различных материалов [28].

6. Заключение

С помощью специальных образцов с наномостиками над микропорами проведены измерения максимальной силы взаимодействия в АСМ-режиме амплитудной модуляции. С помощью теоретического подхода работы [14] выведено аналитическое выражение для максимальной силы в этом режиме при отталкивающем гармоническом законе взаимодействия. Выполнено численное моделирование максимальной силы в режиме амплитудной модуляции, полученные данные количественно согласуются с теорией. Выявлено отличие результатов эксперимента от полученных теоретически и с помощью моделирования более чем на 50%. Проанализированы основные факторы, влияющие на результаты: роль сил адгезии, точность определения добротности кантилевера, точность измерения статической жесткости наномостика, возможное несовпадение его статической и динамической жесткости.

Предложенные образцы с наномостиками представляются перспективными для калибровки АСМ-режимов амплитудной и частотной модуляции, количественной наномеханики, динамических режимов с торсионными кантилеверами.

Результаты работы можно использовать при прогнозировании максимальной силы и деформации не только при гармоническом законе взаимодействия зонда с образцом. Для примера, выясним амплитуду осцилляций кантилевера в АСМ-режиме АМ, обеспечивающую неразрушающее исследование мягких биологических нанообъектов, таких как комплексы белков и/или ДНК. Можно показать, в рамках модели Герца, что деформация ДНК будет сопоставима с ее нанометровым радиусом R_{DNA} , если амплитуда осцилляций заметно превысит $A_0 \sim R_{DNA} \sqrt{Q_C^2 E_{DNA}^2 R_{DNA} k_C^{-2}}$. Радиус кривизны и модуль Юнга материала зонда не влияют на результат, когда они велики по сравнению с соответствующими параметрами нанообъекта. Взяв для оценки значение модуля Юнга ДНК $E_{DNA} = 10^8$ Па и параметры кантилевера из табл. 2, получаем $A_0 \sim 1$ nm. В обычных условиях работа умеренно жесткого кантилевера на столь малых амплитудах затруднена из-за неустойчивости колебаний вблизи поверхности образца, покрытой пленкой адсорбатов (в основном водой). Поэтому при АСМ-исследовании структуры ДНК применяют не только малые

амплитуды и рассогласование, близкое к единице, но и более жесткие зонды [29].

Список литературы

- [1] G. Binnig, C.F. Quate, C. Gerber. *Phys. Rev. Lett.* **56**, 930 (1986).
- [2] B. Bhushan. *Scanning probe microscopy in nanoscience and nanotechnology*. Springer, Heidelberg (2010). 710 p.
- [3] В.Л. Миронов. *Основы сканирующей зондовой микроскопии*. ИФМ РАН, Ниж. Новгород (2004). 110 с.
- [4] S.C. Minne, G. Yaralioglu, S.R. Manalis, J.D. Adams, J. Zesch, A. Atalar, C.F. Quate. *Appl. Phys. Lett.* **72**, 18, 2340 (1998).
- [5] T. Sulchek, R. Hsieh, J.D. Adams, G.G. Yaralioglu, S.C. Minne, C.F. Quate, J.P. Cleveland, A. Atalar, D.M. Adderton. *Appl. Phys. Lett.* **76**, 11, 1473 (2000).
- [6] F. Giessibl, C.F. Quate. *Physics Today*. **59**, 12, 44 (2006).
- [7] M. Radmacher, J.P. Cleveland, M. Fritz, H.G. Hansma, P.K. Hansma. *Biophys. J.* **66**, 2159 (1994).
- [8] B. Pittenger, N. Erina, C. Su. *Bruker Application Note* **128** (2011).
- [9] Q. Zhong, D. Inniss, K. Kjoller, V.B. Elings. *Surf. Sci. Lett.* **290**, L688 (1993).
- [10] T.R. Albrecht, P. Grutter, D. Horne, D. Rugar. *J. Appl. Phys.* **69**, 668 (1991).
- [11] F.J. Giessibl. *Rev. Mod. Phys.* **75**, 3, 949 (2003).
- [12] R. Garcia, R. Perez. *Surf. Sci. Rep.* **47**, 197 (2002).
- [13] L. Nony, R. Boisgard, J.P. Aime. *J. Chem. Phys.* **111**, 1615 (1999).
- [14] H. Bielefeldt, F.J. Giessibl. *Surf. Sci.* **440**, L863 (1999).
- [15] C. Su, L. Huang, K. Kjoller. *Ultramicroscopy* **100**, 233 (2004).
- [16] S.C. Fain, jr., K.A. Barry, M.G. Bush, B. Pittenger, R.N. Louied. *Appl. Phys. Lett.* **76**, 7, 930 (2000).
- [17] O. Sahin, S. Magonov, C. Su, C.F. Quate, O. Solgaard. *Nature Nanotechnology* **2**, 8, 507 (2007).
- [18] O. Sahin, N. Erina. *Nanotechnology* **19**, 445 717 (2008).
- [19] J.P. Spatz, S. Sheiko, M. Moller, R.G. Winkler, P. Reineker, O. Marti. *Nanotechnology* **6**, 40 (1995).
- [20] Э.Н. Корыткова, Л.Н. Пивоварова, О.Е. Семенова, И.А. Дроздова, В.Ф. Повинич, В.В. Гусаров. *ЖНХ* **52**, 3, 388 (2007).
- [21] J.E. Sader. *J. Appl. Phys.* **84**, 64 (1998).
- [22] T.E. Schaffer. *J. Appl. Phys.* **91**, 7, 4739 (2002).
- [23] J.P. Cleveland, B. Anczykowski, A.E. Schmid, V.B. Elings. *Appl. Phys. Lett.* **72**, 20, 2613 (1998).
- [24] Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. *Фейнмановские лекции по физике. Т. 2. Пространство. Время. Движение*. Мир, М. (1965). С. 144.
- [25] J. Tamayo, R. Garcia. *Appl. Phys. Lett.* **73**, 20, 2926 (1998).
- [26] И.А. Няпшаев, Б.О. Щербин, А.В. Анкудинов, Ю.А. Кумзеров, В.Н. Неведомский, А.А. Красилин, О.В. Альмяшева, В.В. Гусаров. *Наносистемы: физика, химия, математика* **2**, 2, 48 (2011).
- [27] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. *Теоретическая физика. Т. 7. Теория упругости*. Наука, М. (1987). С. 116.
- [28] B. Wu, A. Heidelberg, J.J. Boland. *Nature Mater.* **4**, 525 (2005).
- [29] D. Klinov, B. Dwir, E. Kapon, N. Borovok, T. Molotsky, A. Kotlyar. *Nanotechnology* **18**, 225 102 (2007).